



熱燈絲式電子顯微鏡 (Scanning Electron Microscope)

廠牌與型號 :JEOL JSM-6390LV

主要規格:解像力:3 nm @30KV ; 加速電壓: 0~30 KV ; 放大倍率: 25x~300K x ; 二次電子成像(SEI) 背散射電子成像(BSI)

樣本製備要求：

- 不接受揮發性物質,有機物質,有毒物質,未固化之粉末試樣。
- 禁用磁性粉末材料。
- SE 尺寸:直徑 25mm,高度 5mm
- 樣品保持清潔及乾燥，油汙及腐蝕液須清洗乾淨並烘乾。

收費標準：

：校內每小時現金 150 元、校外每小時現金 600 元

開放服務對象：校內、校外學術單位及產業界

聯絡資訊：

- 儀器負責技術員: 廖勝權 先生

TEL:(02)2733-3141#6435/#7375/#3793

E-mail: sclaiw@mail.ntust.edu.tw